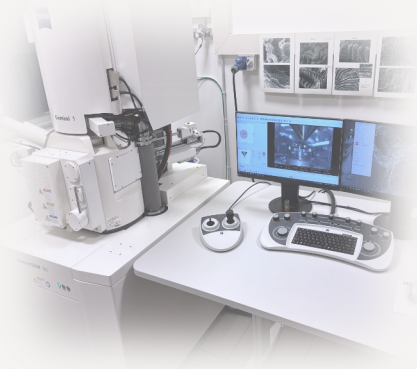


SEM – MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE ZEISS GEMINISEM 360



Caratteristiche Tecniche:

- Risoluzione 0.7 nm elettroni secondari alto vuoto @15kV
- Tensione di accelerazione: da 20V a 30kV, corrente di fascio da 3pA a 20nA
- Ingrandimenti: da 8x a 2.000.000x
- Rivelatore di elettroni secondari, retrodiffusi, aSTEM
- Sistema NanoVP per basso vuoto fino a 500 Pa
- Software di Imaging per post-processing

STRUMENTAZIONI SATELLITE

Leica EM CPD300 — Critical Point Dryer Automatico



Il Leica EM CPD300 è un sistema automatizzato per l'essiccazione a punto critico, utilizzato nella preparazione di campioni per microscopia elettronica a scansione (SEM). Questa tecnica consente di preservare la morfologia tridimensionale dei campioni evitando danni dovuti alle tensioni superficiali tipiche dei metodi di essiccazione tradizionali. Il processo utilizza anidride carbonica come fluido di transizione, sfruttando la sua transizione di fase al punto critico per rimuovere delicatamente i solventi. L'automazione del sistema assicura risultati riproducibili, riducendo il rischio di errori.

EM ACE200 — Dispositivo di rivestimento a basso vuoto



Il Leica EM ACE200 è un sistema da vuoto per il rivestimento di campioni tramite evaporazione a filo di carbonio. Questa tecnica deposita uno strato sottile e uniforme di carbonio amorfo, rendendo i campioni conduttivi per l'osservazione SEM. Il rivestimento, ottenuto sotto vuoto riscaldando un filamento di carbonio, previene l'accumulo di cariche e migliora la qualità delle immagini, risultando particolarmente indicato per campioni biologici e materiali non conduttivi.

Automatic sputter coater Agar



Lo sputter coater automatico consente di rivestire campioni con un sottile strato di oro tramite sputtering in alto vuoto. Questo processo utilizza un plasma di argon per ablare atomi d'oro da un target e depositarli uniformemente sul campione. La metallizzazione è essenziale per rendere i campioni biologici conduttivi, prevenire l'accumulo di carica e migliorare la qualità delle immagini SEM, preservando i dettagli ultrastrutturali.